

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 2 月 15 日 (2007.2.15)

【公開番号】特開 2005-345383 (P2005-345383A)

【公開日】平成 17 年 12 月 15 日 (2005.12.15)

【年通号数】公開・登録公報 2005-049

【出願番号】特願 2004-167621 (P2004-167621)

【国際特許分類】

G 0 1 B 11/24 (2006.01)

G 0 1 B 11/25 (2006.01)

【F I】

G 0 1 B 11/24 K

G 0 1 B 11/24 E

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 12 月 25 日 (2006.12.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 9】

【図 1】透明板状体の表面の平坦度を検査するための検査装置の概要を示す模式図である。

【図 2】ストライプパターンの一例を示す説明図である。

【図 3】本発明による表面形状の検査方法の全体的な流れを示すフローチャートである。

【図 4】C C D カメラの出力信号例を示す波形図である。

【図 5】ストライプパターンを決定する処理の一例を示すフローチャートである。

【図 6】第 1 ステップにおいて決定されたストライプパターンを用いた場合の C C D カメラの出力信号を示す波形図である。

【図 7】第 1 ステップにおいて決定されたストライプパターンを用いた場合の C C D カメラの出力信号を示す波形図である。

【図 8】表面形状検査を実施する様子を示す説明図である。

【図 9】第 2 ステップの概略工程を示すフローチャートである。

【図 10】反射像の画像信号の一例を示す波形図である。

【図 11】観測された反射像の軌跡が理想的平面による反射像に対して先行している状況を示す説明図である。

【図 12】観測された反射像の軌跡が理想的平面による反射像に対して遅延している状況を示す説明図である。

【図 13】観測された反射像の軌跡が理想的平面による反射像に対して先行する場合の先行の程度とうねり形状の傾きとの関係を示す説明図である。

【図 14】観測された反射像の軌跡が理想的平面による反射像に対して遅延する場合の遅延の程度とうねり形状の傾きとの関係を示す説明図である。

【図 15】x 軸および z 軸の定義を示す説明図である。

【図 16】表面反射像と裏面反射像とが同時に形成される様子を示す説明図である。

【図 17】カメラが出力する画像信号例を示す波形図である。

【図 18】カメラが出力する画像信号例を示す波形図である。